



专利

国内专利

国外专利

国内专利

专利名称:	双波长量化相位成像和荧光成像联合系统
专利类别:	发明专利
申请号:	201310016989.0
申请日期:	2013/1/17
第一发明人:	付彦辉
其它发明人:	罗志勇、纪伟、贾策、张翔、仓怀兴、徐涛
国外申请方式:	中国
其它备注:	授权

